

Palestra sobre indicadores tecnológicos e exame de patentes será ministrada amanhã

Amanhã, 20/9, acontece a palestra sobre indicadores tecnológicos e exame de patentes com o pesquisador e coordenador do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), Eduardo Winter. O evento será no Auditório do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET), situado em frente à Biblioteca Comunitária, no horário das 10h às 12h. O palestrante tem experiência como examinador de patentes no INPI e orienta e supervisiona trabalhos na área de prospecção tecnológica aplicada à inovação. A palestra é uma atividade da disciplina de Análise e Desenvolvimento de Patentes, ministrada junto aos Programas de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade e de Ciência e Engenharia de Materiais. Não há necessidade de inscrição prévia e está aberta à participação dos interessados. Mais informações pelo veralui@nit.ufscar.br